

www.ccndt.com 010-62410402

超声波探伤系统测试方法



1.测试方法——灵敏度余量

www.ccndt.com 010-62410402

灵敏度余量

- 目的:检查超声探伤系统经过一段使用时期后灵敏度的变化 情况;
- 使用试块: DB-P的Z20-2;
- 使用探头: 2.5MHz Ø20 直探头; (实际上选用随后探伤将使用的探头)
- 探伤仪设置: (实际上选取随后探伤将使用的调整值)
- a. 抑制置于"0";
- b. 范围置于 "250mm";

测试方法——灵敏度余量

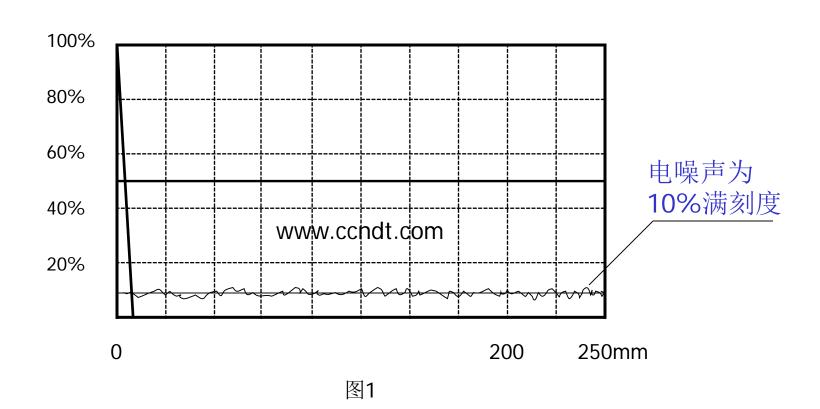


- 将探头表面擦净;
- 调节增益,使电噪声为10%满刻度(图1),记下 此时增益的读数so(单位dB);
- 将探头耦合在试块上(图2),调节增益,使平底 孔的回波幅度降至50%满刻度,记下此时增益的读 数si(单位dB);
- 超声探伤系统的灵敏度余量 s 由(1)式给出:

$$s = si - so \dots (1)$$

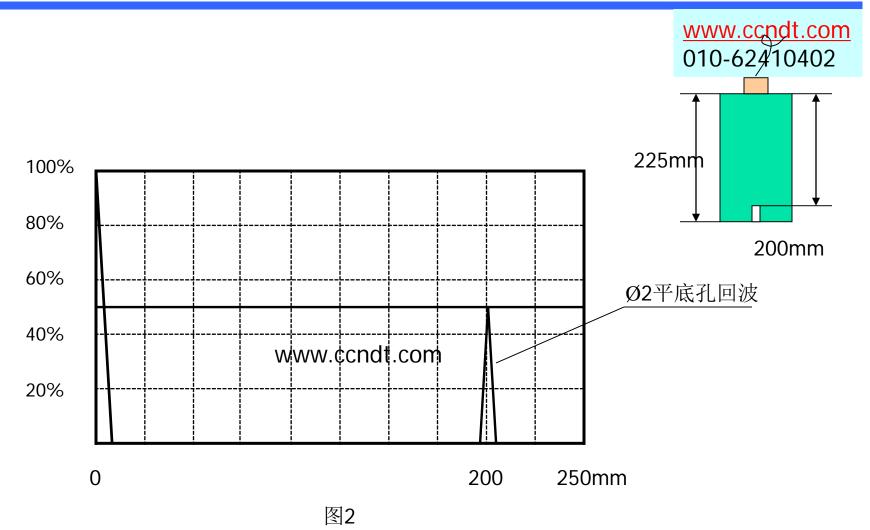








测试方法——灵敏度余量



2.测试方法——垂直线性



www.ccndt.com 010-62410402

垂直线性

- 目的: 检查超声探伤仪增益线性和衰减器精度两者的综合效果;
- 使用试块: DB-P的Z20-2;
- 使用探头: 2.5MHz Ø20 直探头;
- 探伤仪的设置:
- a. 抑制置于"0";
- ы. 范围置于 "250mm";
- c. 增益步距置于 "2dB";

测试方法——垂直线性



www.ccndt.com 010-62410402

- f. 调节增益和探头位置, 使孔波高度恰为100%满刻度(图3)。
- g. 调节衰减器,依次记下每衰减2dB时孔波幅度的百分数,直到 26dB。然后将孔波幅度实测值与表1中的理论值相比较,取最大正偏差d(+)与最大负偏差d(-)之绝对值的和作为垂直线性误差△d,如式(1);

$$\triangle d = |\mathbf{d}_{+}| + |\mathbf{d}_{-}| \qquad (1)$$

式中:

 $\triangle d$ —— 垂直线性误差,以 % 表示。





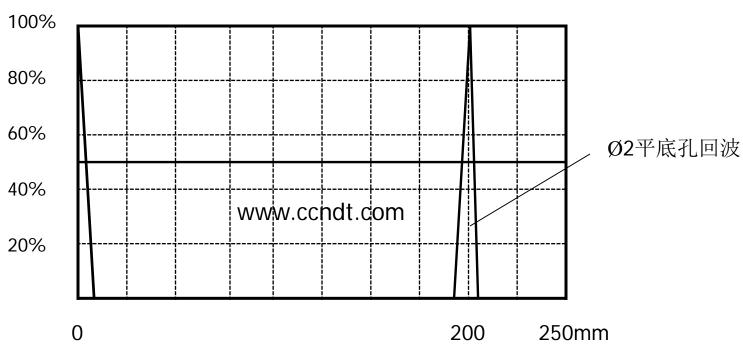


图3

测试方法——垂直线性



www.ccndt.com 010-62410402

表一: 垂直线性测试记录

衰减量dB	波高理论值%	测试值%	偏差%
0	100	100	0
2	79.4	81	1.6
4	63.1	65	1.9
6	50.1	51	0.9
8	39.8 www.c	ndt.com ⁴⁰	0.2
10	31.6	32	0.4
12	25.1	24	-1.1
14	20.0	20	0
16	15.8	16	0.2
18	12.5	12	-0.5
20	10.0	11	1
22	7.9	8	0.1
24	6.3	6	-0.3
26	5.0	4	-1

水平线性--测试方法



- 将校准好的直探头置于CSK-1B试块上,对准 25 mm大平面;
- 调整探测范围、增益,使屏幕出现5次回波.

水平线性--测试方法



www.ccndt.com

010-62410402

测试值(mm)	测试值(mm)	偏差 (mm)
	07.4	
25	25.1	+0.1
50	50.5	+0.5
75	74.6	-0.4
100	100.2	+0.2
125	124.9	-0.1

水平线形误差=0.5/0.8*125=0.5%

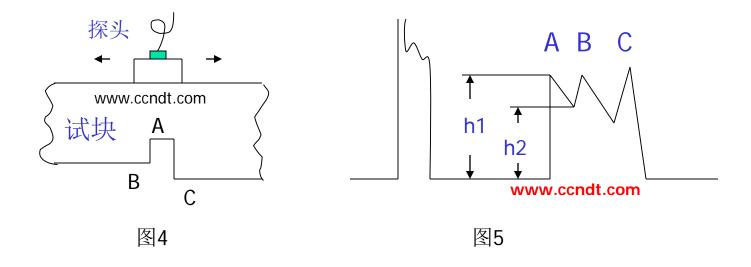
4.测试方法——分辨力



www.ccndt.com 010-62410402

分辨力

- 目的:检查超声探伤系统的分辨力。
- 使用试块: 1号标准试块(JB/T10063)或CSK-IA型试块;
- 使用探头: 2.5MHz Ø20 直探头;



测试方法——分辨力



- 将探头耦合在试块上图4所示的位置,移动探头,使A、B两个面的回波幅度相等并约为 20%~30%满刻度,如图5中h1。
- 调节增益,使A、B两波峰间的波谷上升到原来 波峰高度,此时衰减器所调节的dB数即为以dB 值表示的超声探伤系统分辨力。

5. 测试方法——盲区



www.ccndt.com 010-62410402

盲区

- 目的:测定超声探伤系统在规定探伤灵敏度下, 从探测面至可探测缺陷的最小距离。
- 使用试块: DZ-1型试块, DB-P的Z20-2试块

测试方法——盲区



- 使用探头: 2.5MHz Ø20 直探头; (实际上选用随后探 伤将使用的探头)
- 探伤仪设置: (实际上选取随后探伤将使用的调整值)
- a. 抑制置于"0";
- ь. 范围置于 "250mm";
- 将探头耦合在Z20-2试块上,调节增益,使来自Z20-2试 块平底孔的回波幅度达50%满刻度
- 将探头耦合在DZ-1试块上,选择能够分得开的最短探测的距离的Ø2横孔,并将孔的回波幅度调至大于50%满刻度,如回波的前沿和始波的后沿相交的波谷低于10%满刻度,则此最短距离即为盲区。

6. 测试方法——斜探头入射点



www.ccndt.com 010-62410402

斜探头入射点

- 目的:测定斜探头声束中心在入射面上的位置。
- 使用试块: 1号标准试块(JB/T10063)或 CSK-IB型试块;

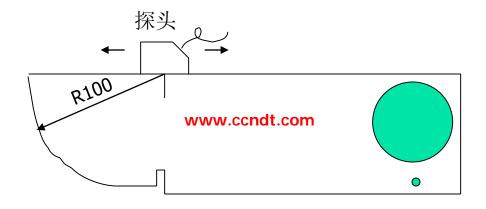
测试方法——斜探头入射点



www.ccndt.com

010-62410402

- 将探头耦合在试块上图6所示的位置,使声束朝向R100 mm的曲面,移动探头,使曲面回波幅度达到最大。
- 读出试块上R100 mm圆心标记线所对应的探头侧面刻度, 此刻度位置即斜探头的入射点。





www.ccndt.com 010-62410402

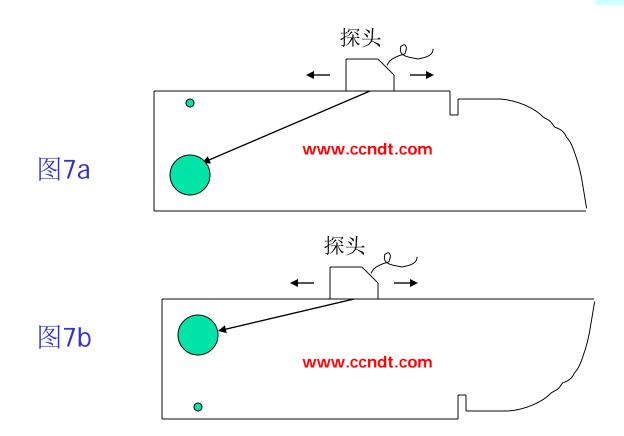
斜探头折射角或K值

- 目的:测定斜探头声束入射于探伤面时的折射 角B或斜探头的K值(K = tg B);
- 使用试块: 1号标准试块(JB/T10063)(折射角) 或CSK-IB型(*K*值)试块;

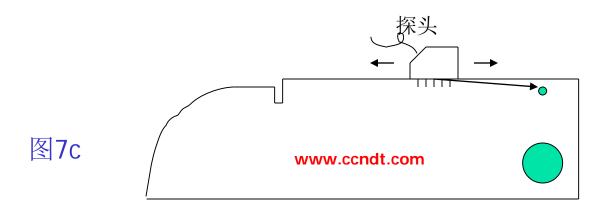


- 根据斜探头折射角 β (或K值)的不同标称值,将探头耦合在试块上的不同位置(如图7);
- a) 折射角为34°~66°($K = 1.0 \sim 1.5$)时,探头放在图7a的位置,使用Ø50mm孔的回波进行测量;
- 的 折射角为 60° ~75° ($K = 2.0 \sim 3.0$)时,探头放在图7b的位置,使用Ø50mm孔的回波进行测量;
- c) 折射角为74°~80°时,探头放在图7c的位置,使用 Ø50mm孔的回波进行测量。









- 保持探头声束轴线与试块侧面平行,移动探头,使曲面回波幅度达到最大。
- 读出探头入射点在试块侧面上对应的角度刻度值(ß或 K 值),此刻度值即为斜探头的折射角(或 K 值)。

8.测试方法——斜探头分辨力



www.ccndt.com 010-62410402

斜探头分辨力

- 目的:检查超声探伤系统(斜探头)的分辨力。
- 使用试块: CSK-IB型试块;

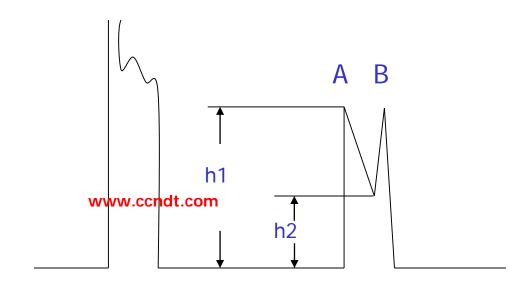
测试方法——斜探头分辨力



- 根据斜探头的折射角 *B* (或 *K* 值)的不同标称值,将 探头耦合在试块上的不同位置(如图7a或图7ab);
- 移动探头,使来自Ø50mm 和Ø44mm 两个孔的回波 A、B幅度相等,并约为20%~30%满刻度,如图8中 h1。
- 调节衰减器,使A、B两波峰间的波谷上升到原来波峰高度,此时衰减器所调节的dB数即为以dB值表示的超声探伤系统分辨力。

测试方法——斜探头分辨力





9.测试方法——斜探头灵敏度余量 北极星辰

www.ccndt.com 010-62410402

斜探头灵敏度余量

- 目的:检查超声探伤系统经过一段使用时期后灵敏度的变化 情况;
- 使用试块: 1号标准试块(JB/T10063)(折射角)或CSK-IA型(K值)试块;
- 使用探头: 2.5MHz 8×9 K2.5斜探头; (实际上选用随后探 伤将使用的探头)
- 探伤仪设置: (实际上选取随后探伤将使用的调整值)
- a. 抑制置于"0";
- ы. 范围置于 "100mm";

测试方法——灵敏度余量



- 将探头表面擦净;
- 调节增益,使电噪声为10%满刻度(图1),记下此时增益的读数a₀(单位dB);
- 将探头耦合在试块上(如图6),使声束朝向*R*100 mm的曲面,移动探头,使曲面回波幅度达到最大。调节增益,使 *R*100 mm的曲面的回波幅度降至50%满刻度,记下此时增益的读数a₁(单位dB);
- 超声探伤系统(斜探头)的灵敏度余量 a 由(3)式给出:

$$a = a_1 - a_0$$
(3)